(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-130340

(43)公開日 平成10年(1998) 5月19日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	FI		
C 0 8 F 232/08		C 0 8 F 232/08		
220/12		220/12		
220/28		220/28		
222/06		222/06		
G03F 7/004	503	G03F 7/004 503A		
		審査請求 未請求 請求項の数19 FD (全 8 頁) 最終頁に続く		
(21)出願番号	特願平 9-94644	(71)出願人 390019839		
		三星電子株式会社		
(22)出願日	平成9年(1997)3月28日	大韓民国京畿道水原市八達区梅羅洞416		
		(72)発明者 崔 相 俊		
(31)優先権主張番号	96P45396	大韓民国京畿道城南市盆唐區九美洞212番		
(32)優先日	1996年10月11日	地 ムジゲマウル住公アパート1207棟1303		
(33)優先権主張国	韓国(KR)	號		
		(72)発明者 朴 春 根		
		大韓民国京畿道水原市八達區仁溪洞319—		
	·	6番地 韓信アパート106棟505號		
		(72) 発明者 高 永 範		
		大韓民国ソウル特別市瑞草區方背3洞1038		
		番地 大字孝學アパート105棟1003號		
		(74)代理人 弁理士 八田 幹雄 (外1名)		

(54) 【発明の名称】 化学増幅型のレジスト組成物

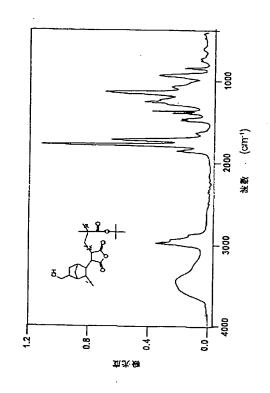
(57)【要約】

【課題】 フォトリソグラフィ工程に用いられる化学増幅型のレジスト組成物を提供する。

【解決手段】 化学増幅型のレジストに用いられる次式で表されるターポリマーを提供する:

【化1】

ここで、 R_1 及び R_2 は水素原子、ヒドロキシル又はカルボキシル基を有する C_0 ~ C_{10} の脂肪族炭化水素であり、 R_3 は水素原子又はメチル、 R_4 はt ープチル又はテトラヒドロピラニルであり、m及び n は整数であり、n / (m+n) は 0 . 1 ~ 0 . 5 である。前記組成物の 重量平均分子量は 3 、 0 0 0 ~ 1 0 0 . 0 0 0 であることが好ましい。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 化学増幅型のレジストに用いられる次式 で表されるコポリマー:

[化1]

ここで、R1及びR2はそれぞれ水素原子、ヒドロキシ ル又はカルボキシル基を有するC。~Cioの脂肪族炭化 水素であり、nは整数である。

【請求項2】 前記組成物の重量平均分子量は3,00 0~100,000であることを特徴とする請求項1に 記載のコポリマー。

【請求項3】 Rıは水素原子、Rzはヒドロキシル基 であることを特徴とする請求項1に記載のコポリマー。

【請求項4】 R₁ は水素原子、R₂ は-CH₂ OHで あることを特徴とする請求項1に記載のコポリマー。

【請求項5】 R1及びR2はそれぞれヒドロキシル基 であることを特徴とする請求項1に記載のコポリマー。

【請求項6】 R1及びR2はそれぞれカルボキシル基 であることを特徴とする請求項1に記載のコポリマー。

【請求項7】 R. 及びR2 はそれぞれカルボン酸無水 物であることを特徴とする請求項1に記載のコポリマ

【請求項8】 化学増幅型のレジストに用いられる次式 で表されるターポリマー:

【化2】

$$\begin{array}{c|c}
R_1 & R_2 \\
\hline
 & m & C=0 \\
\hline
 & R_4
\end{array}$$

ここで、R,及びR。は水素原子、ヒドロキシル又はカ り、R₃ は水素原子又はメチル、R₄ は t ーブチル又は テトラヒドロピラニルであり、m及びnは整数であり、 n/(m+n) は 0. 1~0. 5 である。

【請求項9】 前記組成物の重量平均分子量は3.00 0~100.000であることを特徴とする請求項8に 記載のターポリマー。

【請求項10】 R_1 は水素原子、 R_2 はヒドロキシル 基、R₃は水素原子又はメチル、R₃はtープチル又は テトラヒドロピラニル基であることを特徴とする請求項 8に記載のターポリマー。

【請求項11】 R₁ は水素原子、R₂ は-CH₂ O H、R₃ は水素原子又はメチル、R₄ は t ープチル又は テトラヒドロピラニル基であることを特徴とする請求項 8に記載のターポリマー。

【請求項12】 R1及びR2はそれぞれヒドロキシル 基、R₃は水素原子又はメチル、R₄はtープチル又は テトラヒドロピラニル基であることを特徴とする請求項 8に記載のターポリマー。

【請求項13】 R₁及びR₂はそれぞれカルボキシル 10 基、R₃は水素原子又はメチル、R₄はtーブチル又は テトラヒドロピラニル基であることを特徴とする請求項 8に記載のターポリマー。

【請求項14】 R1及びR2はそれぞれカルボン酸無 水物、R₃ は水素原子又はメチル、R₄ は t ープチル又 はテトラヒドロピラニル基であることを特徴とする請求 項8に記載のターポリマー。

【請求項15】 前記組成物の重量平均分子量は5,0 00~30,000であることを特徴とする請求項8に 記載のターポリマー。

【請求項16】 請求項8に記載のターポリマーとPA Gとを含むレジスト組成物。

【請求項17】 前記PAGの含量が前記ターポリマー の重量に基づいて1~20重量%であることを特徴とす る請求項16に記載のレジスト組成物。

【請求項18】 前記ターポリマーの重量平均分子量は 5,000~20,000であることを特徴とする請求 項16に記載のレジスト組成物。

【請求項19】 前記PAGは、トリアリールスルホニ ウム塩、ジアリールヨードニウム塩及びスルホネートよ 30 りなる群から選ばれたいずれか一つであることを特徴と する請求項16に記載のレジスト組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は化学増幅型のレジス ト組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体チップの集積度が増えるにつれ て、フォトリソグラフィ工程において、サブクォーター ミクロン級の微細パターンの形成が求められる。さら ルボキシル基を有するC。~C10の脂肪族炭化水素であ 40 に、1ギガ(Giga)級以上の素子では、従来のDU V (deep ultraviolet) 248 n m の露光源であるK r Fエキシマーレーザーよりは短い波長を有するArFエ キシマーレーザー193nmを用いるフォトリソグラフ ィ技術が導入されるため、新たなレジスト組成物の開発 が求められている。

> 【0003】一般に、ArFエキシマーレーザー用の化 学増幅型のレジスト組成物は次のような要件を満たさな ければならない。その要件としては、1)193 nmの 波長領域における透明度、2)優れる熱的特性、すなわ 50 ち、高いガラス転移温度 (Tg)、3) 膜質に対する優

3

れる接着力、4) 乾式食刻に対する優れる耐性、5) 現 像時、通常の現像液を利用できるということである。

【0004】上述した特性を要求するArFエキシマーレーザー用のレジスト組成物の一例としては、下記の式*

*のテトラポリマーであるポリ(IBMA-MMA-tB MA-MAA)が提案された。

[0005]

[化3]

【0006】前記レジスト組成物は食刻に対する耐性及び接着力が非常に弱く、現像時には特殊な現像液を用いなければならないという短所がある。このような問題を解決するため、最近は下記の式のようにポリマーのバックボーン(backbone)が環式構造を有するシクロポリマ 20 ーなどが提案されている。

[0007]

【化4】

【0008】しかしながら、このようなシクロポリマーは食刻に対する耐性に関する問題は解決したが、膜質に 30対する接着力が弱くてレジストでリフティング現象が発生する。また、現像時に各種のレジストに広く用いられる通常の現像液の代わりに、特定の範囲内の濃度を有する特殊な現像液を別途に用意する必要があるため非常にややこしい。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的はArF エキシマーレーザー波長を用いて露光可能であり、乾式 食刻に対する耐性及び膜質に対する接着力が良好であ り、通常の現像液により現像可能な化学増幅型のレジス 40 ト組成物を提供することにある。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明の一特徴によれば、化学増幅型のレジストに用いられる次式で表されるコポリマー(copolymer)を提供する:

[0011]

【化5】

R₁ R₂

【0012】ここで、 R_1 及び R_2 はそれぞれ水素原子、ヒドロキシル又はカルボキシル基を有する C_0 C_0 の脂肪族炭化水素であり、n は整数である。前記組成物の重量平均分子量は3,000~100,000が好ましい。

【0013】本発明の他の特徴によれば、化学増幅型のレジストに用いられる次式で表されるターポリマー (terpolymer) を提供する:

[0014]

【化6】

$$\begin{array}{c|cccc}
R_1 & R_2 & R_3 \\
\hline
 & m & C=0 \\
\hline
 & 0 & 0 \\
\hline
 & R_4
\end{array}$$

【0015】ここで、 R_1 及び R_2 は水素原子、ヒドロキシル又はカルボキシル基を有する C_0 ~ C_{10} の脂肪族炭化水素であり、 R_3 は水素原子又はメチル、 R_4 は t 一ブチル又はテトラヒドロピラニルであり、m及びnは整数であり、n/ (m+n) は 0.1 ~ 0.5 である。前記組成物の重量平均分子量は 3.00 ~ 100 0

【0016】本発明のさらに他の特徴によれば、前記ターポリマーとPAG (Photoacid generator) とを含むレジスト組成物を提供する。

50 【0017】前記PAGの含量は前記ターポリマーの重

量に基づいて1~20重量%であることが好ましい。前 記PAGは、トリアリールスルホニウム塩、ジアリール ヨードニウム塩及びスルホネートよりなる群から選ばれ たいずれか一つであることが好ましい。

[0018]

【発明の実施の形態】以下、添付図面に基づき本発明の*

$$CH_{2}OH$$

$$R_{1}$$

$$C=0$$

$$C(CH_{2})$$

$$C(CH_{2})$$

$$C(1)$$

【0021】前記の露光メカニズムから、前記露光工程 前の高分子(1)は現像液にほとんど溶解しないが、酸 触媒下の露光工程後の高分子([])は現像液に良好に 溶解する。

【0022】次に、本発明の望ましい実施例を添付図面 を参照して詳しく説明する。

(IV)

【0025】12.4g(0.1モル)の5ーノルボル ネン-2-メタノール (【【【】) と9.8g(0.1モ ル) の無水マレイン酸(IV) とを1.31g(0.0 08モル)のAIBN (2, 2'-アゾビスイソブチロ ニトリル)と共に100mlのTHF(テトラヒドロフ ラン)に溶解させ、N2パージのもとに約24時間 6 5~70℃の温度を保持しながら重合させた。

(III)

【0026】重合済みの反応物をn-ヘキサンで沈殿さ せた後、沈殿物を約50℃で保持される真空オーブン内 で約24時間乾燥させてコポリマー (V) 生成物を得た 40 本実施例によるコーポリマーの合成反応は次式で表され (収率:70%)。この場合、前記生成物の重量平均分 子量は4、500であり、分散度(重量平均分子量/数 - 平均分子量) は 2. 5 であった (分子量は G P C (Ge★

(VI)

【0019】下記の式は、本発明の望ましい実施例によ り提供された高分子の露光メカニズムを示す:

[0020]

【化7】

※【0023】 [実施例1]

コポリマーの合成

本実施例によるコポリマーの合成反応は次式で表され る。

[0024]

[化8]

★1 Permeation Chromatography)により測定した)。

【0027】このようにして得られたコポリマー(V) 生成物に対するFTIR(FourierTransform Infrared Radiation) スペクトル分析の結果は次のとおりであ る。

[0028] FTIR (KBr) : 3400 cm⁻¹ (-OH), $1.782 \text{ cm}^{-1} \text{ (C=O)}$

〔実施例2〕

コポリマーの合成

る。

[0029]

【化9】

7

【0030】 $16.4g(0.1 \pi \nu)$ の5-/ルボルネン-2.3-ジカルボン酸(VI) と $9.8g(0.1 \pi \nu)$ の無水マレイン酸(IV) とを120mIのTHFに溶解させた後、ここに $1.31g(0.008 \pi \nu)$ のAIBNを加え、 N_2 雰囲気下に約24時間、 $65\sim70$ ℃の温度で重合させた。

【0031】重合済みの反応物をN-ヘキサンで沈殿させた後、沈殿物を約50℃の温度で保持される真空オーブン内で約24時間乾燥させてコポリマー(VII)生*

*成物を得た(収率:70%)。この場合、前記生成物の 重量平均分子量は5,500であり、分散度は2.4で あった。

【0032】 [実施例3]

ターポリマーの合成

本実施例によるターポリマーの合成反応は次式で表される。

[0033] 【化10】

【0034】ここで、 R_1 は水素原子又はメチルであり、 R_2 は t ーブチル又はテトラヒドロピラニルである。

【0036】重合済みの反応物をn-(n+y)で沈殿させた後、沈殿物を約50℃で保持される真空オーブン内で約24時間乾燥させてターポリマー(IX)生成物を30得た(収率:70%)。この場合、前記生成物の重量平均分子量は6000、m:nの比率は1:1(したがってn/(m+n)=0.5)、分散度は2.4、ガラス転移温度(Tg)は135℃であった。

【0037】図1は上述したように得られるターポリマー(IX) 生成物に対するFTIRスペクトル分析の結果を示すグラフであり、その結果は次のとおりである。 【0038】IR (KBr) : 3400cm $^{-1}$ (-OH) 、1784cm $^{-1}$ (C=O) 、1722cm $^{-1}$ (C

(B) R₂ がテトラヒドロピラニルの場合 tーメタクリル酸ブチルの代わりに 17g (0.1モル)のメタクリル酸テトラヒドロピラニルを用いて前記 (A) のような方法でターポリマー (IX) 生成物が得 られた(収率:70%)。この場合、前記生成物の重量

平均分子量は5500であり、分散度は2.3であっ

=0)

た。

【0039】このようにして得られたターポリマー(IX)生成物に対するFTIRスペクトル分析の結果は次のとおりである。

[0040] IR (KBr) : $3400 cm^{-1}$ (-OH), $1784 cm^{-1}$ (C=O), $1723 cm^{-1}$ (C=O)

20 [実施例4]

レジスト組成物の製造

前記の実施例 3 から得られた 1 gのターポリマー(IX)を 7 gのプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(PGMEA)に溶解させた後、0. 0 2 gのトリフェニルスルホニウムトリフラートを加えて十分に撹拌した。次いで、前記混合物を 0. 2 μ mのマイクロフィルターを用いて濾過させた後、得られたレジスト組成物をウェーハ上に約 0. 5 μ mの厚さでコーティングした。

【0041】前記コーティングされたウェーハを約140 \mathbb{C} の温度で約90 秒間のベーキングを行い、0.45の開口数 (NA)を有するKrFエキシマーレーザーを 照射して露光した後、約140 \mathbb{C} の温度で約90 秒間の ポストベーキングを行った。その後、約2.38 重量% のTMAH (tetramethyl ammonium hydroxide) 溶液を 用いて約60 秒間の現像を行った。

【0042】図2において、(a)及び(b)はこのようにして得られたレジスト組成物に対し、それぞれ31 mJ/cm²のエネルギー及び260nmの波長を有す 3 m3/cm²のエネルギー及び200nmの波長を有する露光源を用いて露光し、その後現像してフォトレジストパターンを形成する場合の断面図を示す。図2からわかるように、各々の波長帯域で優れる断面プロフィールが得られる。

【0043】図3は、本発明のレジスト組成物に関する UVスペクトルの各波数に対する透過度を測定した結果 である。図3において、曲線(1)はPAGを添加しな い純粋なレジスト組成物の透過度を、曲線(m)は1w t%のPAG、すなわちトリフェニルスルホニウム ト リフレート(triphenylsulfonium triflate)が添加され

10

たレジスト組成物の透過度を、曲線 (n) は2wt%の PAG(上記と同じ)が添加されたレジスト組成物の誘 過度を示す。図3の結果からわかるように、波長193 nmにおける透過度が、PAGを添加しない純粋なレジ スト組成物の場合には65%、1wt%のPAGが添加 されたレジスト組成物の場合には53%、2wt%のP AGが添加されたレジスト組成物の場合には43%であ ると測定された。

[0044]

組成物は乾式食刻に対して優れる耐性を有し、現像時に 現像液として通常の方法で用いる現像液、例えば2.3 8wt%のTMAH現像液を用いることができ、膜質に 対しても優れる接着力を提供する。

【0045】上述したように、本発明の望ましい実施例 を詳しく説明したが、本発明は前記の実施例に限るもの でなく、本発明の技術的な思想の範囲内で当分野の通常 の知識を持つ者により様々な変形が可能なのは明らかで ある。

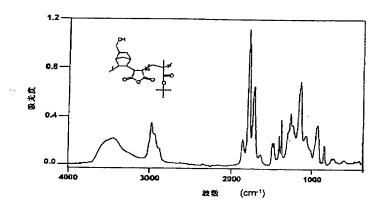
【図面の簡単な説明】

【図1】本発明によるターポリマー生成物に対してFT 【Rスペクトル分析の結果を示すグラフである。

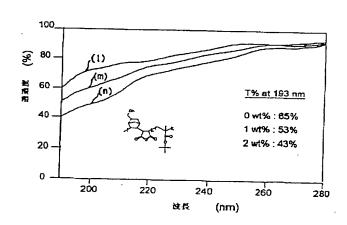
【図2】本発明によるレジスト組成物を用いてフォトレ 【発明の効果】本発明の望ましい実施例によるレジスト 10 ジストパターンを形成する場合の断面図をSEM写真で 示すものである。

> 【図3】本発明によるレジスト組成物に対してUVスペ クトルの各波長による透過度を測定する結果を示すグラ フである。

[図1]

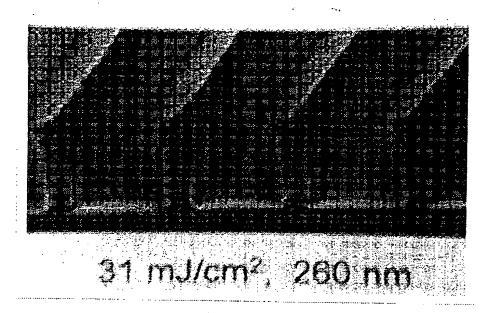


【図3】

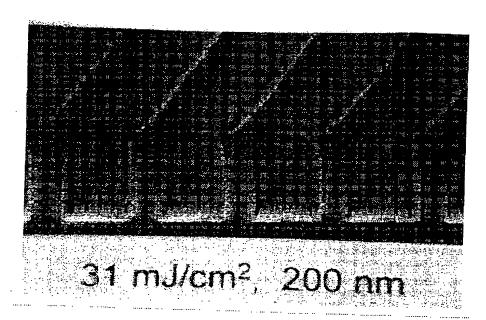


[図2]

(a)



(b)



図面代用写真

フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁶	i I	識別記号	FI		
G 0 3 F	7/039	6 0 1	G 0 3 F	7/039	601
H 0 1 L	21/027		C 0 8 G	61/08	
// C08G	61/08		H 0 1 L	21/30	502R